

分離工学セミナー「サブナノポア測定技術の最新動向：多孔質吸着剤および分離膜の開発に向けて」

主催：日本膜学会, 化学工学会膜分科会, 化学工学会中国四国支部, 中国地区化学工学懇話会, CREST「多様な水源に対応できるロバスト RO/NF 膜の開発」

共催：化学工学会, 日本化学会, 吸着学会(予定)

趣旨：吸着剤, 多孔質分離膜などにおいて, 1 nm 以下のサブナノ領域の細孔は, 分離性の発現や新規材料開発の観点から極めて重要である。近年, 陽電子消滅法 (Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy, PALS), DFT 法など新規なサブナノ細孔測定技術が発達し, より一般的に利用できるようになって来た。しかしながら, サブナノ細孔の評価法はいまだチャレンジングであり, 開発研究の必要な分野である。本シンポジウムでは, サブナノ細孔に焦点を絞り, 粉末, フィルム, 膜としての測定例, 測定法について最新動向を概観する。

開催日時：2015年4月2日(木) 13:00~17:40 (懇親会 18:30-20:00)

開催場所：広島大学工学部 117 教室

アクセス：山陽本線「西条駅」下車, バス 15 分「大学会館前」バス停下車, または, 山陽新幹線「東広島駅」下車, タクシー 10 分, 広島バスセンターから直行バス約 1 時間, 「大学会館前」下車

〔講演〕

1. 「陽電子消滅によるサブナノ空間解析：基礎と応用」 (13:00~13:40)
(産総研) 伊藤 賢志 氏
2. 「陽電子消滅によるサブナノ空間解析：高品質ビームの形成と利用」 (13:40~14:10)
(産総研) オローク ブライアン 氏
3. 「陽電子消滅によるサブナノ空間解析：機能化学部材の評価」 (14:10~14:40)
(産総研) 萩原 英昭 氏
4. 「蒸気吸着偏光解析法による多孔質薄膜の高感度細孔評価」 (14:40~15:10)
(株) 東レリサーチセンター) 吉本 茂 氏
<休憩 (15:10~15:20)>
5. 「NLDFT 法による最先端のガス吸着細孔径分布解析技術」 (15:20~16:00)
(カンタクローム・インスツルメンツ) 佐藤 純 氏
6. 「マルチガス拡散法によるサブナノ空隙構造評価」 (16:00~16:30)
(広島大学) 吉岡 朋久 氏
7. 「吸着を用いたゼオライト膜の非破壊測定手法およびその解析方法」 (16:30~17:10)
(早稲田大学) 瀬下 雅博 氏
8. 「Normalized Knudsen-based Permeance (NKP) によるアモルファスシリカ膜の細孔径評価」 (17:10~17:40)
(広島大学) 金指 正言 氏

〔懇親会〕 (18:30~20:00) (次郎丸)

参加費：無料, 懇親会：2,000-3,000 円

申込締切：2015年3月13日(金)

申込先：〒739-8527 東広島市鏡山 1-4-1 広島大学大学院工学研究院 化学工学専攻 金指 正言
TEL (082) 424-2035, FAX (082) 424-5494, E-mail : kanezashi@hiroshima-u.ac.jp
<http://home.hiroshima-u.ac.jp/membrane/index.html>